



# 第220回触媒化学研究センター談話会

---

演 題： 界面と薄膜の構造をひもとく赤外 MAIR分  
光法の原理と実際

講演者： 長谷川 健

(触媒化学研究センター客員准教授、東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻)

日 時： 2007年 9月13日(木)  
15:00 - 16:30

会 場： 北海道大学創成科学研究棟  
4階 セミナー室 B,C

要 旨：

界面に吸着した分子や薄膜には界面場の影響が顕著に現れ、バルクのとくとは異なる構造・反応性・物性を示す場合が多い。これら界面に特有な性質は、界面および吸着分子の構造異方性を読み解くことで理解できるようになるため、既存の分光法の解析限界を超える新しい分光学的な解析手段の開発も必要である。2002年に構築・提案した多角入射分解(MAIR)分光法は、光の進行方向に平行な電場振動を持つ仮想的な光を、回帰的に組み込むことで実現した、界面吸着種の構造解析に有効な新しい分光分析法である。講演では、この方法の原理と、これまでに行ってきた応用事例を紹介し、実際の応用範囲や今後の発展性などについて考える。

《連絡先》触媒化学研究センター 表面分子化学部門 大澤 雅俊

(TEL: 011-706-9123 )

主催：触媒化学研究センター